

Актуальный перечень услуг ЦКП-ИТ

№ п/п	Наименование услуги	Используемое научное оборудование	Продолжительность	Себестоимость	Стоимость
1	2	4	5	6	7
1	Электронно-микроскопическая диагностика микро и нано-объектов и электронно-ионная литография, в т.ч.: электронная литография на резисте; ионно-лучевая литография; локальное осаждение и травление материала под действием электронно-ионного пучка; создание специализированных зондов на основе висцерных структур	Электронный микроскоп (Комплекс электронно-ионной литографии) серии CrossBeam 1540XB, Вакуумная напылительная установка SPI	8	3088	7700
	В том числе на безвозмездной основе			3088	0
2	Диагностика микро и нано-объектов различной природы на электронном микроскопе.	Учебный оптико-электронный микроскоп Phenom	4	1228	1700
	В том числе на безвозмездной основе			1228	0
3	Характеризация поверхности в сканирующем зондовом микроскопе, в т.ч: а) создание специализированных зондов на основе коллоидных наночастиц б) динамическая силовая литография в сканирующем зондовом микроскопе	Сверхвысоковакуумный атомно-силовой микроскоп SPM Probe VT AFM XA 650, Вакуумная напылительная установка SPI	12	3888	7500
	В том числе на безвозмездной основе			3888	0
4	Получение и диагностика оксидных предкерамических нанопорошков и материалов на их основе	Лазерный анализатор размеров частиц динамического рассеяния света Horiba LB 550V, Установка высокого давления КИ-250	76	26624	36000
	В том числе на безвозмездной основе			26624	0
5	Гранулометрический анализ состава материала, характеристика дисперсности	Лазерный анализатор размеров частиц динамического рассеяния света Horiba LB 550V	4	1164	1600
	В том числе на безвозмездной основе			1556	0
6	Технологический процесс пробоподготовки при разработке технологии производства оптических материалов	Установка для вакуумного напыления, Измеритель комплексных коэффициентов передачи и отражения "P4M-18"	7	2007	2200
7	Диагностика наноматериалов, графена, углеродных нанотрубок	Микроскоп для лабораторных исследований Axio Imager.Z1 Лазерный сканирующий блок LSM 710 для микроскопа Axio Imager.Z1, Сканирующий спектрофлуориметр, Спектрометр	10	2655	4300
8	Определение состава нанокристаллов галогенидов металлов в аморфной силикатной матрице стекла методом рентгеновского дифракционного анализа	Рентгеновский дифрактометр Rigaku Ultima IV	12	4308	8000
9	Определение температуры плавления наноразмерных кристаллов методом дифференциально-сканирующей калориметрии	Прибор синхронного термического анализа	12	4068	5000

10	Определение теплоемкости, температуры и кинетики фазовых переходов нанокompозитных материалов методом ДСК	Прибор синхронного термического анализа	18	6102	7800
11	Обучение и практические занятия с использованием сканирующего спектрофлуориметра Cary Eclipse и спектрометра EPP2000-NIRX-SR InGaAs-512	Сканирующий спектрофлуориметр, Спектрометр	4	1180	0
12	Обучение и практические занятия с использованием измерителя комплексных коэффициентов передачи и отражения «P4M-18»	Измеритель комплексных коэффициентов передачи и отражения «P4M-18»	2	562	0
13	АСМ -измерения	Многофункциональная зондовая установка для проведения комплексных наномасштабных исследований оптических метаматериалов	4	4000	5200
14	МСМ -измерения	Многофункциональная зондовая установка для проведения комплексных наномасштабных исследований оптических метаматериалов	4	4000	5200
15	Измерение спектров комбинационного рассеяния света	Многофункциональная зондовая установка для проведения комплексных наномасштабных исследований оптических метаматериалов	4	2000	2600
16	Измерение спектров рассеяния	Система ввода-вывода излучения с тремя независимыми оптическими каналами и вспомогательными оптико-механическими элементами для стыковки сканирующего зондового микроскопа с микроспектрометром	4	2500	3250
17	Измерение спектров пропускания	Система ввода-вывода излучения с тремя независимыми оптическими каналами и вспомогательными оптико-механическими элементами для стыковки сканирующего зондового микроскопа с микроспектрометром	4	2000	2600
18	Измерение спектров отражения	Система ввода-вывода излучения с тремя независимыми оптическими каналами и вспомогательными оптико-механическими элементами для стыковки сканирующего зондового микроскопа с микроспектрометром	4	2500	3250

Исполнительный директор ЦКП-НТ (А.О. Голубок)